

「ASNITE 試験 IT 認定の一般要求事項 (TIRP21)」改正要旨

認定センター製品認定課

改正理由及び改正箇所

- ①経済産業省委託事業「企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業（高度大規模半導体集積回路セキュリティ評価技術開発）」に係る我が国でのスマートカード等のハードウェア評価事業の立ち上げに対応し、コモンクライテリア評価認定区分を「ハードウェア（スマートカード等）評価」と「ソフトウェア評価」に分類し、脆弱性試験のみを実施する機関を認定するために「システム LSI 侵入テスト」区分を設けた。

<主な改正箇所>

1.2 適用範囲

2.2 マネジメントシステムの対象範囲

2.4 下請負契約

第4部 システム LSI 侵入テストを行う事業者に対する一般要求事項

5.3 技術的能力の定期的な確認

- ②IPA(独立行政法人情報処理推進機構)と米国 NIST(National Institute of Standards and Technology、国立標準技術研究所)が、それぞれの機関で実施している暗号モジュール試験及び認証制度について、両制度間で共同認証を行うことを基本的に合意したことを受け、認定要求事項を NIST HANDBOOK 150-17 に整合させた。また、認定区分を暗号ソフトウェアモジュール試験及び暗号ハードウェアモジュール試験に分け、認定範囲の体系を NIST の体系と合わせた。

<主な改正箇所>

第3部 暗号モジュール試験を行う事業者に対する一般要求事項

5.3 技術的能力の定期的な確認

- ③②に関連し、コモンクライテリア評価区分の要求事項 (TIRP21 第2部) において NIST HANDBOOK 150-20 と重複する部分は NIST HANDBOOK の表現に整合させた。

<主な改正箇所>

2.5 技術的記録

2.16 設備の保有及び設備の維持

2.17 測定のトレーサビリティ

- ④平成 19 年度以降の ASNITE 試験 IT 評定委員会での意見を踏まえ、要求事項が不明

確な部分は明確化した。

<主な改正箇所>

2.3 組織

2.11 施設及び環境条件

⑤平成 21 年度以降の CC 認証機関からの要請を受けて要求事項が不十分な部分は追加をした。

<主な改正箇所>

2.1 一般

2.7 マネジメントレビュー

2.8 要員の適格性及び資格

2.9 要員の教育・訓練

2.10 要員の管理

⑥IAJapan 測定のトレーサビリティに関する方針（URP24）改正を受けて、当該文書を引用することに修正した。

<主な改正箇所>

2.17 測定のトレーサビリティ

3.19 測定のトレーサビリティ

⑦マルチサイト事業者の認定に対する要求事項を追加した。

<主な改正箇所>

附属書 1

⑧認定を維持するための遵守事項に、認定に用いられる規格を用いた認証行為の禁止を追加した。

<主な改正箇所>

5.5 認定に用いられる規格を用いた認証行為の禁止

以上